

Аннотация

Дисциплина «Теоретические основы нанодиагностики» входит в вариативную часть образовательной программы подготовки студентов по направлению/специальности «27.03.01 «Стандартизация и метрология » направленность «Метрология, стандартизация, сертификация». Дисциплина реализуется кафедрой №6.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника

профессиональных компетенций:

ПК-4 «способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией метрологического сопровождения технологических процессов производства, а также в умении обоснованно выбирать современные средства измерений и осуществлять контроль характеристик выпускаемой и эксплуатируемой нанопродукции.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Язык обучения по дисциплине «русский».